Analog-Digital-Wandler

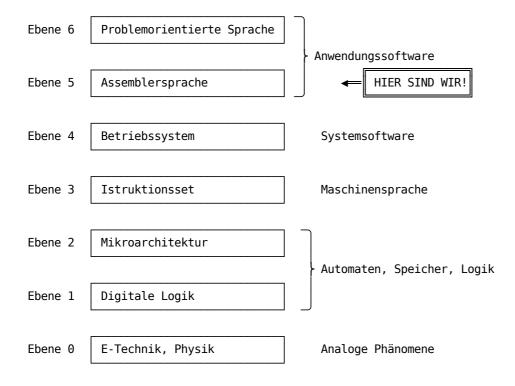
Parameter	Kursinformationen
Veranstaltung:	Digitale Systeme / Eingebettete Systeme
Semester	Wintersemester 2023/24
Hochschule:	Technische Universität Freiberg
Inhalte:	Grundlagen und Verwendung des Analog-Digital- Wandlers
Link auf GitHub:	https://github.com/TUBAF-IfI- LiaScript/VL EingebetteteSysteme/blob/master/14 ADC.md
Autoren	Sebastian Zug & André Dietrich & Fabian Bär



Fragen an die Veranstaltung

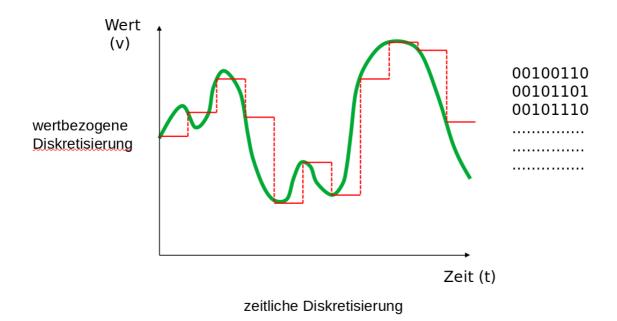
- Was bedeutet der Begriff Auflösung im Zusammenhang mit einem Analog-Digital-Wandler?
- Welche Wandlungsmethoden kennen Sie, worin unterscheiden sich diese?
- Welches Wandlungskonzept ist im AVR-Core implementiert?
- Welche Störungen entstehen ggf. bei der Analog-Digital-Wandlung?
- Wovon hängt die Wandlungsdauer beim AVR ab? Durch welche Paramter können Sie diese beeinflussen?

Abstraktionsebenen



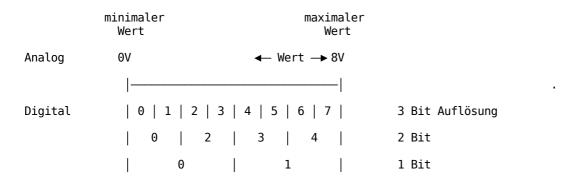
Motivation

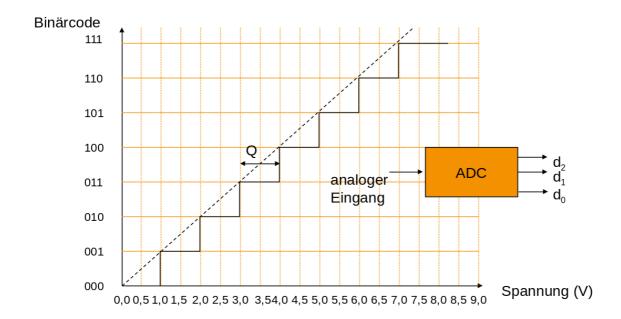
In der vorangegangenen Vorlesung sprachen wir insbesondere über die Erfassung von digitalen Signalen. Eine Erfassung von analogen Werten ist allerdings notwendig, um Phänomene der Umgebung mit dem notwendigen Detailgrad beobachten zu können.



Dabei wird das zeit- und wertkontinuierliche Eingangssignal in eine zeit- und wertdiskrete Darstellung überführt.

Die Idee besteht darin einem Spannungswert einer Zahlenrepräsentation zuzuordnen, die einen Indexwert innerhalb eines beschränkten Spannungswert repräsentiert.





Daraus ergibt sich die zentrale Gleichung für die Interpretation des Ausgaben eines Analog-Digital-Wandlers

$$ADC = rac{V_{in}}{V_{ref}}ADC_{res}$$

oder

$$\frac{ADC \cdot V_{ref}}{ADC_{res}} = V_{in}$$

Für unser Beispiel aus der Grafik zuvor bedeutet die Ausgabe von "5" bei einem 3-Bit-Wandler, also

$$\frac{5 \cdot 8V}{2^3} = 5V$$

Der potentielle Quantisierungsfehler Q beträgt

_ _

$$Q = \frac{8V}{2^3} = 1V$$

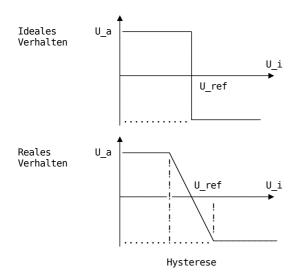
Dabei erfolgt die Wandlung in zwei generellen Schritten. Zunächst wird das Signal zeitlich diskretisiert und darauffolgend wertbezogenen gewandelt.

Analog Komperator

Ein Komparator ist eine elektronische Schaltung, die zwei Spannungen vergleicht. Der Ausgang zeigt in binärer/digitaler Form an, welche der beiden Eingangsspannungen höher ist. Damit handelt es sich praktisch um einen 1-Bit-Analog-Digital-Umsetzer.

Comparator Symbol [OPAMP]

Comparator Funktionsprinzip [OPAMP]



Im AVR findet sich ein Komperator, der unterschiedliche Eingänge miteinander vergleichen kann: Für "+" sind dies die BANDGAP Reference und der Eingang AINO und für "-" der Pin AIN1 sowie alle analogen Eingänge.

Analog Comperator, Seite 243 [megaAVR]

Die grundlegende Konfiguration erfolgt über die Konfiguration der Bits / Register :

Bits	Register	Bedeutung
ACBG	ACSR	Analog Comparator Bandgap Select
ACME	ADCSRB	Analog Comparator Multiplexer Enable - Bit im Register
ADEN	ADCSRA	Analog Digital Enable
MUX2, MUX1,	ADMUX	Mulitiplexer Analog input

Dazu kommen noch weitere Parameterisierungen bezüglich der Interrupts, der Aktivitierung von Timerfunktionalität oder der Synchronisierung.

Weitere Erläuterungen finden Sie im Handbuch auf Seite

Aufgabe: An welchen Pins eines Arduino Uno Boards müssen Analoge Eingänge angeschlossen werden, um die zwei Signale mit dem Komperator zu vergleichen. Nutzen Sie den Belegungsplan (Schematics) des Kontrollers, der unter <u>Link</u> zu finden ist.

Ein Beispiel für den Vergleich eines Infrarot Distanzsensors mit einem fest vorgegebenen Spannungswert findet sich im *Example* Ordner der Veranstaltung.

Einschränkung von Tinkercad 2. The ANALOG COMPARE feature, which is a possible interrupt source on the mega328P, does not work at all (output compare result ACO in register ACSR does not seem to change, no matter what voltages are presented at pins 6,7).

[OPAMP] Wikipedia, Autor Omegatron - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=983276

[megaAVR] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Link

Analog Digital Wandler

Voraussetzung für den Wandlungsprozess ist die Sequenzierung des Signals. Mit einer spezifischen Taktrate wird das kontinuierliche Signal erfasst.

Wie sollte die Taktrate für die Messung denn gewählt werden?

PrintSampleResults.py

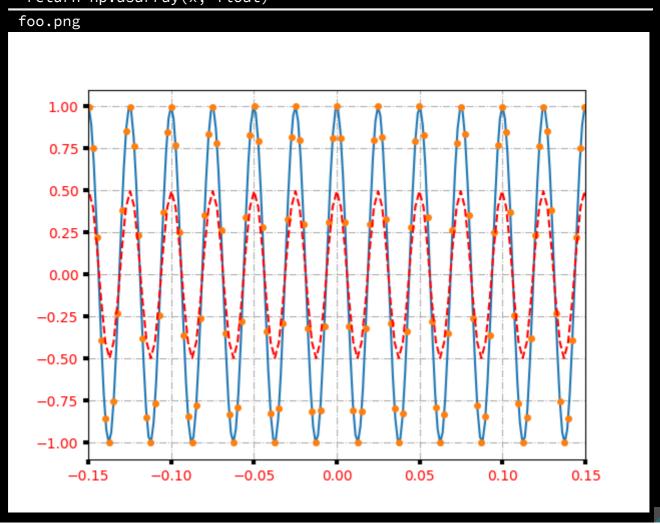
```
import numpy as np
2
   import matplotlib.pyplot as plt
 3
4 # Generierung der "Realen Messungen"
 5 f = 40 \# Hz
6 tmin = -0.3
7 tmax = 0.3
8 t = np.linspace(tmin, tmax, 400)
9 s = np.cos(2*np.pi*f*t)
10
11 # Abtastung mit einer Frequenz kleiner der Grenzfrequenz
12 T = 1/401.0
13 nmin = np.ceil((tmin) / T)
14 nmax = np.floor(tmax / T)
15  n = np.arange(nmin, nmax) * T
16 y = np.cos(2*np.pi*f*n)
17
   # Fitting eines Cosinussignals anhand der Messungen
18
19 mfft=np.fft.fft(y)
20 imax=np.argmax(np.absolute(mfft))
21 mask=np.zeros_like(mfft)
22 mask[[imax]]=1
23 mfft*=mask
24 fdata=np.fft.ifft(mfft)
25
26 # Ausgabe
27
   fig, ax = plt.subplots()
28 ax.plot(t, s)
   ax.plot(n, y, '.', markersize=8)
29
30 ax.plot(n, fdata, '--', color='red', label=f"Estimated Signal")
31 ax.grid(True, linestyle='-.')
32 ax.tick_params(labelcolor='r', labelsize='medium', width=3)
33
   ax.set_xlim([-0.15, 0.15])
34
35 #plt.show()
36 plt.savefig('foo.png')
```

```
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/matplotlib/cbook.py:1699:
ComplexWarning: Casting complex values to real discards the imaginary
part
   return math.isfinite(val)
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/matplotlib/cbook.py:1345:
```

ComplexWarning: Casting complex values to real discards the imaginary

return np.asarray(x, float)

part



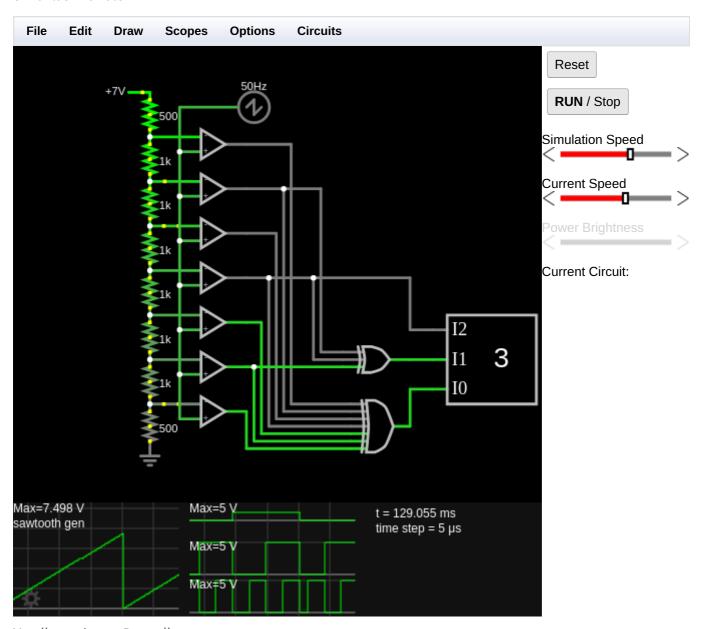
s Wenn ein kontinuierliches Signal, das keine Frequenzkomponenten hat, die über einer Frequenz f_c liegen mit einer Häufigkeit von größer $2f_c$ abgetatstet wird, kann das Originalsignal aus den gewonnenen Punkten unverzerrt rekonstruiert werden.

Falls dieses Kriterium nicht eingehalten wird, entstehen nichtlineare Verzerrungen, die auch als Alias-Effekt bezeichnet werden (vgl. Python Beispiel). Die untere Grenze für eine Alias-freie Abtastung wird auch als *Nyquist-Rate* bezeichnet.

Als Erklärung kann eine Darstellung des Signals im Frequenzbereich dienen:

Flashwandler

3 Bit Flashwandler



Verallgemeinerte Darstellung

Vorteil

• Hohe Geschwindigkeit

Nachteil

- Energieverbrauch größer
- Hardwareaufwand für höhere Auflösungen

https://www.youtube.com/watch?v=x7oPVWLD59Y

Sequenzielle Wandler

Sequenzielle Wandler umgehen die Notwendigkeit mehrerer Komperatoren, in dem das Referenzsignal variabel erzeugt wird.

Dafür ist allerdings ein Digital-Analog-Wandler nötig, der die Vergleichsspannung ausgehend von einer digitalen Konfiguration vornimmt.

Zählverfahren

Vorteil

- sehr hohe Auflösungen möglich
- Schaltung einfach umsetzbar kritisches Element DAC/Komperator

Nachteil

- Variierende Wandlungsdauer
- langsam (verglichen mit dem Flashwandler)

Sukzessive Approximation/Wägeverfahren

Vorteil

• Gleiche Wandlungsdauer

Herausforderungen bei der Wandlung

Fehlertypen

- Quantisierungsfehler sind bedingt durch die Auflösung des Wandlers
- Offsetfehler ergeben sich aus einer Abweichung der Referenzspannung und führen zu einem konstanten Fehler.
- Verstärkungsfehler im Analog-Digitalwandler wirken einen wertabhängigen Fehler.
- Der Linearitätsfehler ist die Abweichung von der Geraden. Linearitätsfehler lassen sich nicht abgleichen.

Merke: Die Fehlerparameter hängen in starkem Maße von der Konfiguration des Wandlers (Sample Frequenz, Arbeitsbreite, Umgebungstemperatur) ab!

Datenblatt AD-Wandler 8 Bit DIL-8, TLC0831, TLC0831IP [Texas_TLC]

Referenzspannung

Eine Herausforderung liegt in der stabilen Bereitstellung der Referenzspannung für den Analog-Digital-Wandler.

[Texas_TLC] Firma Texas Instruments, Datenblatt AD-Wandler 8 Bit DIL-8, TLC0831, TLC0831IP

Parameter eines Analog-Digital-Wandlers

- Auflösung
- Messdauer
- Leistungsaufnahme
- Stabilität der Referenzspannung
- Unipolare/Bipolare Messungen
- Zahl der Eingänge
- Ausgangsinterfaces (parallele Pins, Bus)
- Temperaturabhängigkeit und Rauschverhalten (Gain, Nicht-Linearität, Offset)

Umsetzung im AVR

Handbuch des Atmega328p	Bedeutung
10-Bit Auflösung	
0.5 LSB Integral Non-Linearity	maximale Abweichung zwischen der idealen und der eigentlichen analogen Signalverlauf am Wandler
+/- 2 LSB Absolute Genauigkeit	Summe der Fehler inklusive Quantisierungsfehler, Offset Fehler etc. (worst case Situation)
13 - 260μs Conversion Time	Die Dauer der Wandlung hängt von der Auflösung und der der vorgegebenen Taktrate ab.
Up to 76.9kSPS (Up to 15kSPS at Maximum Resolution)	
0 - V CC ADC Input Voltage Range	Es sind keine negativen Spannungen möglich.
Temperature Sensor Input Channel	
Sleep Mode Noise Canceler	Reduzierung des Steuquellen durch einen "Sleepmode" für die CPU

megaAVR $^{\circ}$ Data Sheet, Seite 247 $^{[\text{megaAVR}]}$

Trigger für den Wandlung

Grundsätzlich sind 3 Modi für die Wandlung möglich:

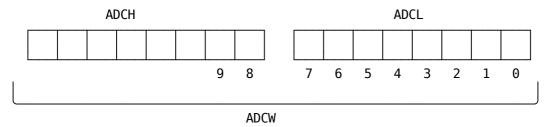
- Programmgetriggerte Ausführung der Wandlung
- Kontinuierliche Wandlung
- ereignisgetriebener Start

megaAVR® Data Sheet, Seite 247 [megaAVR]

megaAVR® Data Sheet, Seite 250 [megaAVR]

Ergebnisregister

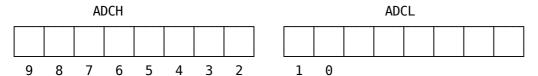
Die Atmega Prozessoren bieten eine Auflösung von 10Bit oder 8Bit für die analogen Wandlungen. Entsprechend stehen zwei Register ADCL und ADCH für die Speicherung bereit. Standardmäßig (d.h. ADLAR == 0) werden die niederwertigsten 8 im Register ADCL bereitgehalten und die zwei höherwertigsten im Register ADCH.



Das Ergebnis ergibt sich dann zu

```
uint8_t theLowADC = ADCL
uint16_t theTenBitResults = ADCH<<8 | theLowADC;</pre>
```

Ist keine 10-bit Genauigkeit erforderlich, wird diese Zuordnung durch das Setzen des ADLAR Bits im ADMUX Register angepasst. Auf diese Weise kann das ADC Ergebnis direkt als 8 Bit Zahl aus ADCH ausgelesen werden.



Merke: Immer zuerst ADCL und erst dann ADCH auslesen.

Beim Zugriff auf ADCL wird das ADCH Register gegenüber Veränderungen vom ADC gesperrt. Erst beim nächsten Auslesen des ADCH-Registers wird diese Sperre wieder aufgehoben. Dadurch ist sichergestellt, dass die Inhalte von ADCL und ADCH immer aus demselben Wandlungsergebnis stammen, selbst wenn der ADC im Hintergrund im Free-Conversion-Mode arbeitet.

[megaAVR] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Link

Beispiele

Der Simulative Eingang x (0 bis 5V) ist an A0 angeschlossen.

Simulation time: 00:15.179

```
void setup() {
   pinMode(A0,INPUT);
   Serial.begin(9600);

//analogReference(INTERNAL);

void loop() {
   Serial.println(analogRead(A0));
   delay(25);
}
```

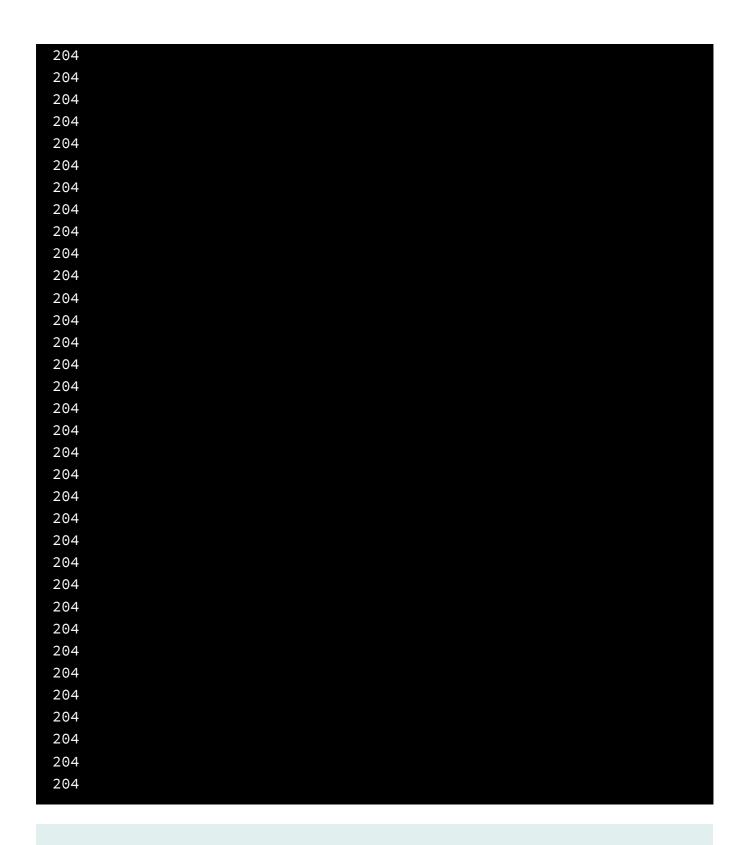
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204 204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204	
204 204	
204	

204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204 204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			

204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204 204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			

204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204 204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			

204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204 204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			
204			

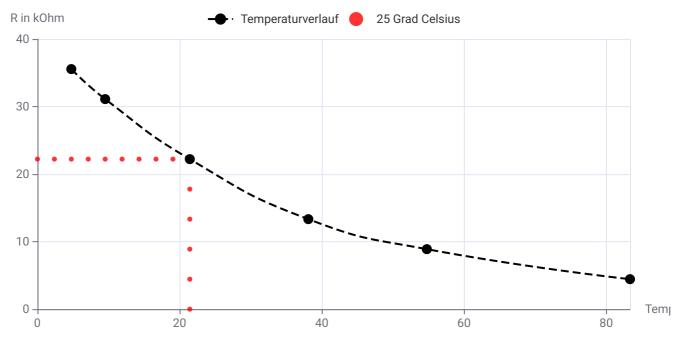


Aufgabe: Recherchieren Sie die Varianten von analogReference() für einzelne Vertreter der Arduino Familie. Warum unterscheiden sich die Parameter?

Beispiel 1 - Heißleiter

NTC-Widerstände (*Negative Temperature Coefficient*) werden zur Messung der Temperatur eingesetzt. Wichtigster Kennwert eines NTCs ist der Nennwiderstand R25 bei einer Nenntemperatur von 25 °C.

NTC-Widerstand Kennlinie



$$egin{split} rac{R_{NTC}}{R_1} &= rac{U_{NTC}}{U_{R1}} = rac{U_{NTC}}{(U_{ges} - U_{NTC})} \ R_{NTC} &= R_1 \cdot rac{U_{NTC}}{(U_{ges} - U_{NTC})} \end{split}$$

Wenn wir davon ausgehen, dass die Referenzspannung des AD-Wandlers gleich U_{ges} ist, generieren wir eine digitale Repräsentation U_{NTC_d} entsprechend

$$U_{NTC_d} = U_{NTC} \cdot rac{U_{ges}}{ADC_{resolution}}$$

Wie interpretieren wir somit einen beispielhaften Wert von 628 am Ende des Wandlungsprozesses?

$$U_{NTC} = U_{NTC_d} \cdot rac{ADC_{resolution}}{U_{qes}}$$

Mit diesem Spannungswert können wir nun den zugrundeliegenden Widerstand berechnen und letztendlich die Temperatur.

Beispiel 2 - Lesen eines Analogen Distanzsensors

Für das Beispiel wird der AtMega2560 verwendet, der eine interne Referenzspannung von 2.56 V anstatt der des AtMega328 von 1.1 V bereit stellt.

```
megaAVR® Data Sheet, Seite 281 [megaAVR2560]
```

Die Bedeutung ergibt sich beim Blick ins Datenblatt des Sensors GP2D, dessen Maximalwertausgabewert liegt bei etwa 2.55V

```
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL // 16 MHz clock speed
#endif
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int readADC(int channel) {
  int i; int result = 0;
  // Den ADC aktivieren und Teilungsfaktor auf 64 stellen
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1);
  // Kanal des Multiplexers & Interne Referenzspannung (2,56 V)
  ADMUX = channel | (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
  // Den ADC initialisieren und einen sog. Dummyreadout machen
  ADCSRA = (1 << ADSC);
  while(ADCSRA & (1<<ADSC));</pre>
  ADCSRA = (1 << ADSC);
  while(ADCSRA & (1<<ADSC)); // Auf Ergebnis warten...</pre>
  // Lesen des egisters "ADCW" takes care of how to read ADCL and ADCH.
  result = ADCW;
  // ADC wieder deaktivieren
  ADCSRA = 0;
  return result;
}
int main(void)
  Serial.begin(9600);
  while (1) //infinite loop
    int result individual = readADC(0);
    Serial.println(result_individual);
    Serial.flush();
    _delay_ms(10); //1 second delay
  return 0; // wird nie erreicht
}
```

The first ADC conversion result after switching reference voltage source may be inaccurate, and the user is advised to discard this result. Handbuch Seite 252

[megaAVR2560] Firma Atmel, Atmel ATmega640/V-1280/V-1281/V-2560/V-2561/V, Seite 281, Link

Beispiel 3 - Temperaturüberwachung des Controllers

The temperature measurement is based on an on-chip temperature sensor that is coupled to a single ended ADC8 channel. Selecting the ADC8 channel by writing the MUX3...0 bits in ADMUX register to "1000" enables the temperature sensor. The internal 1.1V voltage reference must also be selected for the ADC voltage reference source in the temperature sensor measurement. When the temperature sensor is enabled, the ADC converter can be used in single conversion mode to measure the voltage over the temperature sensor. Handbuch Seite 256

```
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL // 16 MHz clock speed
#endif
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
double getTemp(void)
    unsigned int wADC;
    double t;
    // Set the internal reference and mux.
    ADMUX = (1 << REFS1) | (1 << REFS0) | (1 << MUX3));
    ADCSRA |= (1<<ADEN); // enable the ADC
    // wait for voltages to become stable.
   delay(20);
   // Start the ADC
   ADCSRA = (1 << ADSC);
    // Detect end-of-conversion
    while (ADCSRA & (1<<ADSC));</pre>
    wADC = ADCW;
    // The offset of 324.31 could be wrong. It is just an indication.
    t = (wADC - 324.31) / 1.22;
    // The returned temperature is in degrees Celsius.
```

```
return (t);
}
int main(void)
{
    Serial.begin(9600);
    while (1)
    {
        Serial.println(getTemp());
        Serial.flush();
        _delay_ms(10); //1 second delay
    }
    return 0; // wird nie erreicht
}
```

[megaAVR] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Link